オープン・ショート・リーク　テストシステム

AITS-OSL

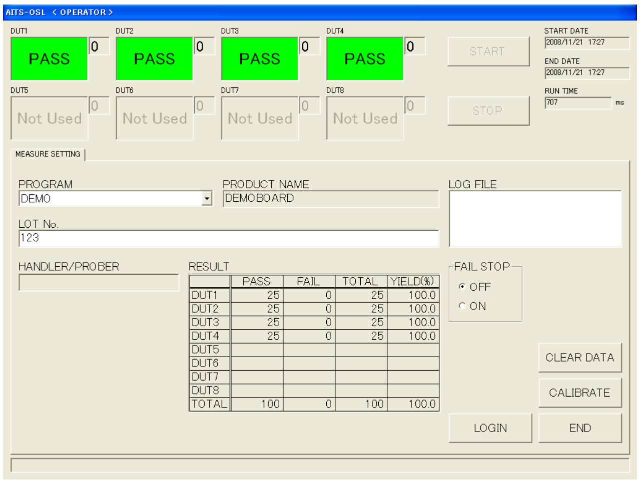
特長

- LSI の多ピン化に対応した Low コスト版コンパクトテスタ
- 1 個測で最大 2048 ピンのデバイスに対応可能
- 被試験デバイス(DUT)を最大 8 個同時測定可能
- オープン・ショート検査だけではなく、リーク検査も可能
- 検査する LSI に合わせてピン数をカスタマイズ可能
- プログラム言語の習得が不要

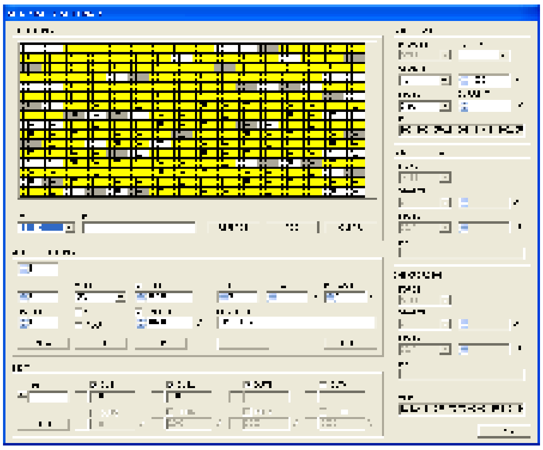
基本構成

定電圧・定電流源(VIC/P)を搭載したマトリクス DC 測定テスタです。
オペレーティングシステムには Windows を採用し、GUI ベースの容易な操作性を実現しています。
検査プログラムは、デバイスの検査ピンを選択し、検査条件を入力して作成する為、プログラム言語を習得する必要はありません。
ハンドラ／プローバとの接続時には、端子のピン配置をソフトウェアで設定できる為、多種のハンドラ／プローバに対応できます。

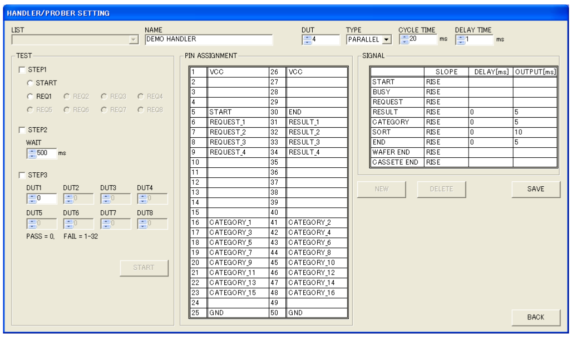
量産画面



検査プログラム作成画面



ハンドラ設定画面

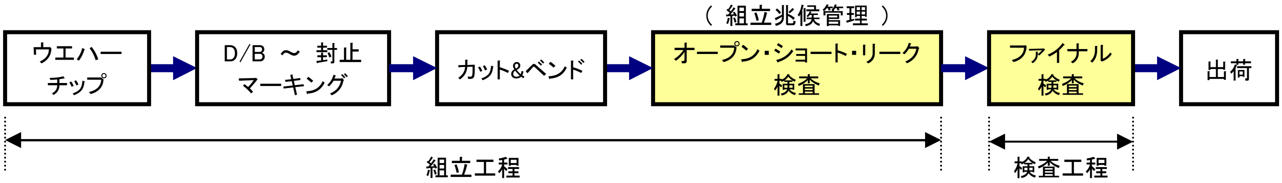


用途

- バーンイン検査前後のデバイスを簡易的に選別
- 最終出荷前の選別検査、出荷直前の混入検査
- 組立工程の兆候管理（組立不良解析 ＆ 歩留りの安定化）
- デバイス(試作品)評価

＜ 使用事例 ＞

組立工程に兆候管理(ワイヤー断線／ボンディング不良の除去)を追加することで、コスト低減が可能



仕様

DC モジュール		
定電圧･定電流源 (VIC/P)	チャンネル数	4ch / ボード
	出力範囲	±18V / ±30mA
	分解能	16bit
	電圧レンジ	2 / 8 / 18V
	電流レンジ	0.03 / 0.3 / 3 / 30mA
マトリックス	ピン数	128pin / ボード

標準仕様（4 個測、1024pin 仕様）	
寸法(W×H×D)	600 × 700※1 × 700
重量	65kg 以下
消費電力	250VA 以下
電源	100V ± 10%　50 / 60Hz

その他		
同測数※2	標準仕様 4 個測 1024pin	1DUT × 1024pin
		2DUT × 512pin
		4DUT × 256pin
	カスタマイズ 8 個測 2048pin	1DUT × 2048pin
		2DUT × 1024pin
		4DUT × 512pin
		8DUT × 256pin
テストヘッド※3	お客様とのお打ち合わせ	
キャリブレーション	あり	
自己診断※3	外付けの自己診断 BOX を使用	
外部 I/F	TTL（ハンドラ／プローバ通信用）	
	USB2.0	
	LAN（10/100/1000Base-Tx）	

※1 寸法の高さは、キャスターを除いた高さです。（キャスターを取り付けた場合、70mm 高くなります。）
※2 同測数は 1 / 2 / 4 / 8 個同測の中から選択できます。
※3 テストヘッド、自己診断は、オプションです。
製品デザイン、仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

<u>※ ご要望に応じて追加ソフトウェア開発等も承ります。</u>

株式会社シキノハイテック

□吉島工場　〒937-0041 富山県魚津市吉島 829
TEL (0765) 23-6176　FAX (0765) 23-6172

□九州事業所　〒808-0135 北九州市若松区ひびきの 1-5
共同研究開発センター2 号館 202 号室
TEL (093) 695-3613　FAX (093) 695-3614

Shikino
http://www.shikino.co.jp

本社
〒937-0017 富山県魚津市江口 2184
TEL (0765) 22-3477 (代)
FAX (0765) 22-3916 (代)